

走査型プローブ顕微鏡（Bruker Nano 社製 NanoScopeV 型コントローラー搭載マルチモード 8JSPM システム）

製造元	Bruker Nano Inc.
仕様	最大走査範囲 x:125 μ m, y: 125 μ m, z:5 μ m
保有部署	材料化学専攻 無機構造化学分野
設置場所	桂・A2棟・化学系 コアラボ
利用期間・時間、 利用料金	本設備の共同利用規程を参照 https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/sg65gg/
注意事項等	利用申請前に利用の概略を下記連絡先に必ずお知らせいただき承認を得てください。
連絡先	材料化学専攻 無機構造化学分野 助教 清水雅弘 075-383-2463 shimizu.masahiro.3m (at) kyoto-u.ac.jp http://func.mc.kyoto-u.ac.jp/ 利用申請前に利用の概略をこちら宛に必ずお知らせいただき承認を得てください。
キーワード	表面形状測定、表面物性測定
機器コード	0000110006
自由記入欄	鋭利な探針で試料表面を走査し、微小領域における表面形状や物性の測定が可能

